

Спекроскопический рефлектометр

Eli-RP

Спектральная рефлектометрия (SR) является надежным, быстрым и точным методом для анализа толщины пленки и оценки ее отражательной способности. Eli-RP обладает уникальной передовой технологией анализа m-FFT для точного и быстрого измерения тонких пленок.

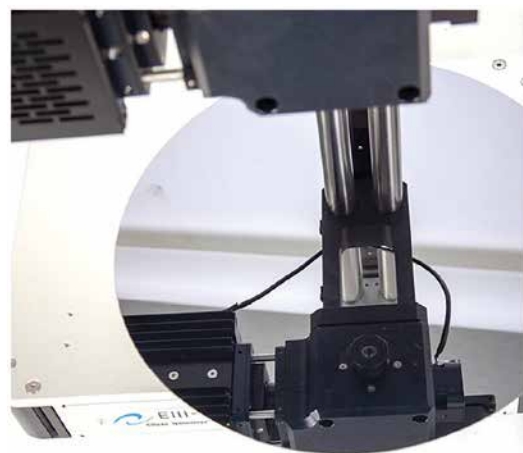
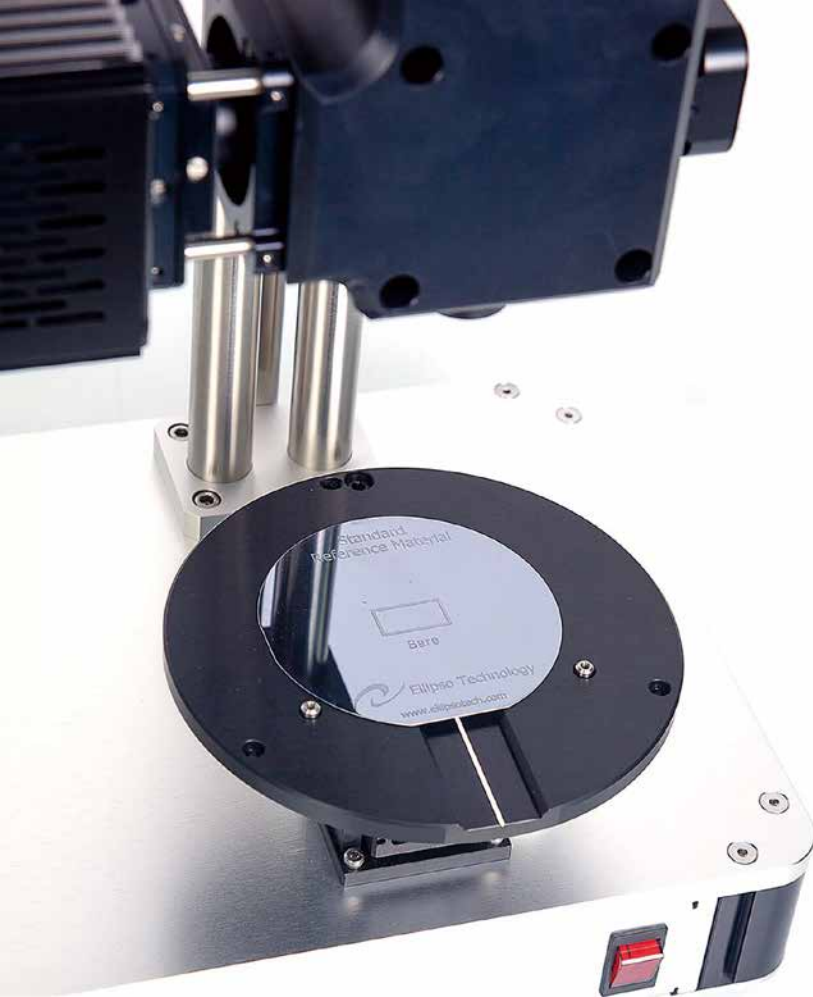


ОСОБЕННОСТИ

- Простота и высокая скорость измерений
- Высокая воспроизводимость анализа
- Бесконтактный неразрушающий метод анализа
- Возможность измерения многослойных материалов
- Функциональная библиотека дисперсии материалов
- Функции экспорта и импорта данных
- Измерение отражательной способности передней и задней поверхностей
- Расширяемые библиотеки
- Опции 2D- и 3D-картирования поверхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измеряемые параметры	Толщина пленки, отражательная способность
Диапазон толщин	От 1 нм до 20 мкм (зависит от типа пленки)
Рабочий спектральный диапазон	380 – 1050 нм Опции: UV1 193 – 1050 нм; IR1: 900 – 1700 нм; IR2: 900 – 2200 нм
Скорость анализа	1 сек/точка (зависит от типа пленки)
Диаметр измерительного пятна	1 мм
Угол падения излучения	90° (нормальное падение)
Количество анализируемых слоев	До 5 слоев (зависит от типа пленки)
Воспроизводимость (3σ)	± 0.05 нм на 10 измерений
Рабочее расстояние	120 мм (возможность кастомизации)
Макс. размер образца	Ø150 мм (возможность кастомизации)



Elli-RP

Elli-RPX
Technology

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Определение толщины тонких пленок диэлектриков, полупроводников, полимеров
- Измерение отражательной способности
- Измеряемые материалы:
 - Полупроводники: Si, Ge, ONO, ZnO, PR, BLT, поликристаллический-Si, GaN, GaAs
 - Дисплеи: ITO, PR, MgO, Alq₃, CuPc, PVK, PAF, PEDT-PSS
 - Диэлектрики: SiO₂, TiO₂, Ta₂O₅, ITO, AlN, ZrO₂, Si₃N₄, Ga₂O₃, влажное окисление
 - Полимеры: красители, NPB, MNA, PVA, PET, TAC, PR
 - Химия: органические пленки (OLED), тонкие пленки Ленгмюра-Блоджетт
 - Солнечные элементы: SiN, a-Si, поликристаллический Si, SiO₂, Al₂O₃
- Оптические покрытия: просветляющие, фильтрующие, упрочняющие

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

- Система автоматического картирования (Ø150мм, Ø200мм, Ø300мм)
- Опции расширения рабочего диапазона: UV1: 193 – 1050 нм; IR1: 900 – 1700 нм; IR2: 900 – 2200 нм
- Измерение толстых пленок до 300 мкм
- Увеличенное рабочее расстояние до 1000 мм
- Кастомизация для производственных линий



(WooMan-dong)2F, EL-Tower, 358, GwonGwang-ro,
PalDal-gu, SuWon-si, GyeongGi-do, 16498, Korea.
Tel. 82-31-214-0440 Fax. 82-31-214-0441
www.ellipsotech.com



Официальный дистрибьютор в РФ ООО «Промэнерголаб»
105318, Россия, г. Москва, ул. Ткацкая, 1
Тел.: +7 (495) 22-11-208, 8 (800) 23-41-208
E-mail: info@czl.ru, www.czl.ru